科研分析服务测试：SEM，TEM，XRD，BET等

采购类别：服务

**采购需求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | 名称 | 数量 |
| 1 | SEM测试 | 150次 |
| 2 | TEM测试 | 95次 |
| 3 | XRD测试 | 80次 |
| 4 | BET测试 | 70次 |
| 5 | 红外测试 | 100次 |

**测试要求：**

1. SEM

样品形态：粉体、块状和薄膜

样品成分：无磁/弱磁

前处理要求：纯金（Au）靶材

测试模式：二次电子或背散射

放大倍数需求：0-20万倍

设备类型：场发射

1. TEM

样品形态：粉末

样品成分：强磁/弱磁

前处理：离子减薄、双喷、FIB、切片

放大倍数需求：0-100万倍

设备类型：场发射

高分辨制样：超薄碳膜或微栅

1. XRD

样品形态：粉体、块状、薄膜和液体

样品成分：无磁稳定，不含水

精细谱元素：Si、C、F、Ti、Ag、S、Cu

最大功率0.5-2.5 kW

扫描模式:theta、2theta，范围 0.2 ~120°；

能量分辨优于350 eV

1. BET

样品形态：粉体、块体

成分：分子筛、MOF材料

吸附所需气体：N2、CO2

样品成分：无磁稳定，不含水

比表面积：5-120

测试质量：全孔、微孔和介孔

1. 红外测试

样品形态：粉体、块状、薄膜和液体

测试模式：吸光度/透过率

样品主要成分：高分子树脂、硅烷类长链

光谱范围:400-4000cm-1

**注：项目总价不超过16万。**